ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故時の制御棒材の共晶溶融挙動に関する研究 (17) 溶融ステンレス鋼/B4C 固液反応後の元素濃度分布

Study on Eutectic Melting Behavior of Control Rod Materials in Core Disruptive Accidents of Sodium-Cooled Fast Reactors

(17) Reaction Behavior between Molten Stainless Steel and Solid Boron Carbide
*中村 勤也¹、太田 宏一¹, 江村 優軌², 高井 俊秀², 山野 秀将²

1電中研、2原子力機構

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷時に、燃料に先行して制御棒が溶融・移行する挙動解析モデルを構築する ため、溶融ステンレス鋼(SS)と中性子吸収材(B₄C)の高温反応後のSSを対象に、構成元素の濃度分布を 測定した結果、ホウ素濃度は水平方向に一様である一方、鉛直方向には下方ほど低下する傾向が認められた。 キーワード:ナトリウム冷却高速炉、炭化ホウ素、制御棒、共晶反応、濃度分布

1. 緒言

ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷時において、制御材(B₄C)とステンレス鋼(SS)は約1200℃以上に達 するとその界面近傍で共晶反応により鉄を主成分としホウ素を含む低粘性融体を形成して下方へ移動し、燃 料に先行して形状を喪失すると考えられている。原子力機構は、この共晶反応および融体の移動挙動を解析 するコード開発を進めている^[1]。本報告では、上述解析コードの検証データを取得することを目的に、B₄C と SS の高温反応試験で得られた溶融固化体の断面について、微細組織観察ならびに元素濃度分布を測定した。

2. 濃度分析に供した B4C/SS 高温反応試料

表1に示す2種類の体系で、アルゴンガス雰囲気に置かれたアルミナ製角型容器内で、B4C 焼結体と溶融 SS を反応させたのちに炉冷した^[1-3]。2014-2 試験では、溶融 SS と B4C 焼結体が接触し溶融 SS の凝固が完了 するまで約8分、接触後の溶融 SS の最高温度は1485℃であった。また、2017-4,6 試験ではヒーター温度 1600℃、2017-5,9 試験では同1800℃で加熱された溶融 SS 中に B4C 焼結体を一定時間(0分または1分)浸漬

項目

試験体系

B₄C寸法

溶融SS寸法

重量

備考

後に加熱電源を遮断した。いずれの試験も浸 漬部の B₄C は全量溶解した。冷却後の SS 縦 断面を対象に、電子プロ—ブマイクロアナラ イザー(EPMA) を用いて微細組織観察およ び元素濃度分布を測定した。

3. 溶融 SS 中の元素濃度分布

いずれの試料も、SS 全域にわたり(Cr,αδFe)

と(Cr,Fe)₂B の共晶組織を形成した。SS 中に溶解するホウ素量 が溶解度限以下の場合、試料全域にわたり均一な共晶組織を形 成し、B₄C 焼結体の浸漬位置からの距離によるホウ素濃度分布 に有意な差は見られなかった(2017-4,5,6,9 試験)。一方、溶解 度を超えるホウ素が SS 中に拡散した場合、水平方向には一様 な共晶組織を形成するが、鉛直方向には上方ほど(Cr,Fe)₂B 相の 割合が増加し、上面近傍のみに針状組織(Cr,Fe)₂B が形成され た(図1、2014-2 試験)。図2に示すとおり、底面から上面に 向けてホウ素濃度が単調増加する傾向から、溶融 SS 中のホウ 素の拡散が水平方向に速いものの、下方へは相対的に遅い傾向 が示唆される。これらの結果は、高速炉制御棒の共晶反応およ びその移動挙動解析コードの検証データに活用される。 *本報告は、経済産業省からの受託事業である、平成29 年度および平成 30 年

度高速炉国際協力等技術開発の一環として実施した成果である。

上面 (Сг, αδFe) (Сг, Fe)₂B (С

表 1 B₄C/SS 高温反応試験条件[1-3]

2014 - 2

B₄C焼結体入り容器にSSを出湯

接触面 (W50mm×H25mm) ×D30mm

W131mm×D104mm×H17mm

2.1 kg

試験名

2017-4 2017-5 2017-6 2017-9 B₄C焼結体を溶融SS中に浸漬

W190mm×D190mm×H25mm 8.2 kg

浸漬0分後電源断 浸漬1分後電源断





参考文献

[1] H. Yamano, et al., FR17, IAEA-CN-245-43, [2] 山野ら, 第21回動エネシンポ, 2016, B242, [3] 山野ら, 第23回動エネシンポ, 2018, A224.

* Kinya Nakamura¹, Hirokazu Ohta¹, Yuki Emura², Toshihide Takai², Hidemasa Yamano², ¹CRIEPI, ²JAEA